



# SurfTRiDY – 高解像度対応(受託計測) –

従来のシステムと比べ同じ視野サイズでの測定を高解像度で行えるようになりました。

## 高解像度化したSurfTRiDYの特徴

従来のシステムで使用していたカメラ(640×480画素)から高解像度化したカメラ(1280×1024画素)へと切り替えることで、同じ視野サイズでの測定を高解像度で行えるようになりました。広視野で測定を行う際も従来のシステムと比較して解像度を落とさず計測できるようになっています。また、本システムは今まで使用していたカメラ、データも扱えます。現在は受託計測のみのご対応となっておりますが、今後はSurfTRiDY(kit)としてシステムの販売も予定しています。

## gradient (傾斜角分布)パタン表示での画素数の違いによる画像サイズと積分形状の比較

塩ビ樹脂版に筋状の跡をつけ、従来のシステムと高解像度化したシステムで測定した結果を比較したものです(図1、図2)。

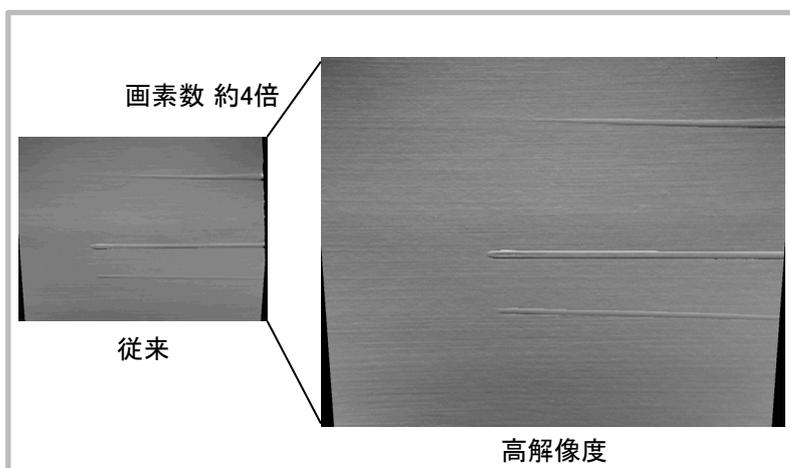


図1 画像サイズの比較

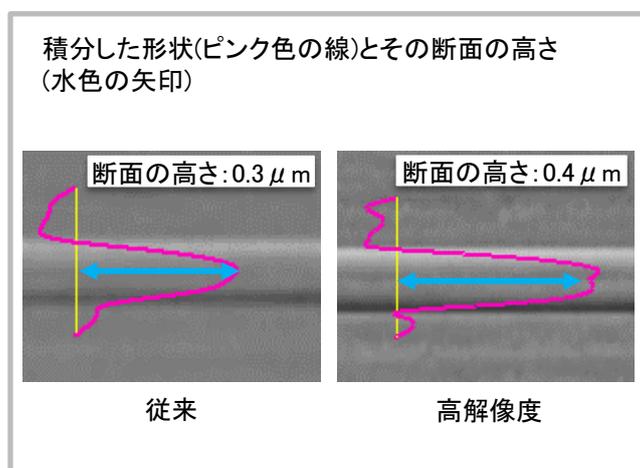


図2 積分形状(断面)の比較

## curvature#2 (曲率分布)パタン表示で画素数の違いによる画像の比較と測定したサンプル

従来のシステムと高解像度化したシステムで測定した結果を比較したもの(図3)と測定に使用した塩ビ樹脂版です(図4)。

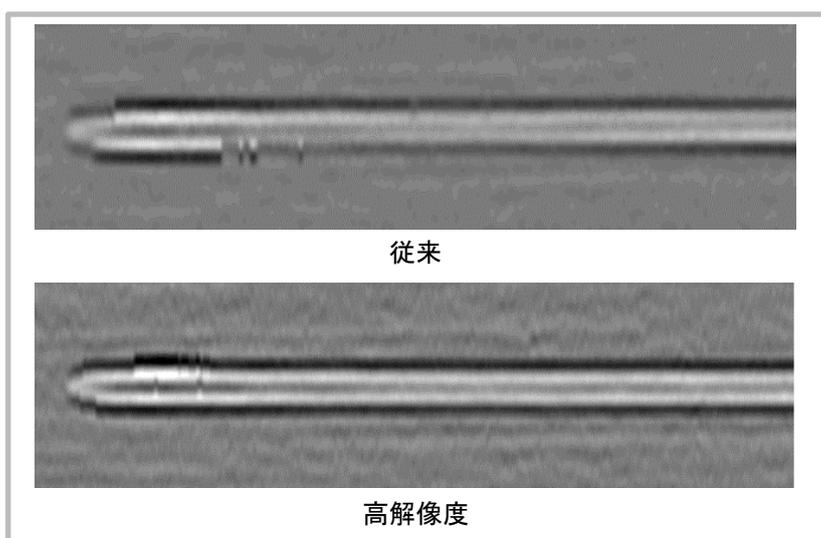


図3 curvature#2パタン表示の比較

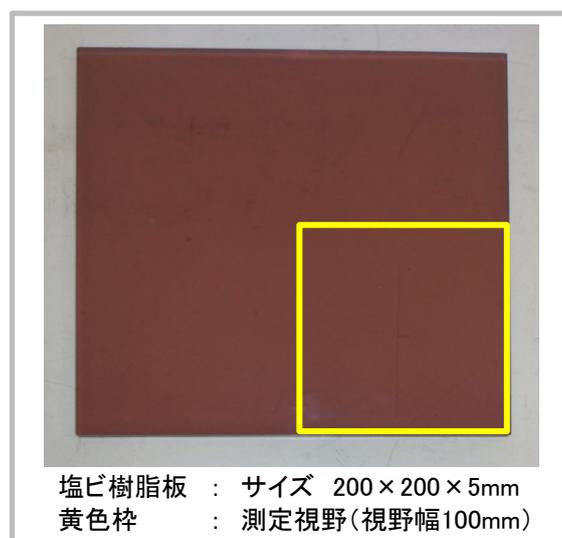


図4 測定したサンプル



JFE テクノリサーチ 株式会社

<https://www.jfe-tec.co.jp>

0120-643-777

Copyright ©2023 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.  
本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。